

Halbleiter-Inspektions- & Kalibrierpaket (3-teilig)

Technische Daten der Hauptkomponenten:

1. Wafer Surface Inspection System

- **Hersteller/Typ:** KLA / Tencor SFS 6220 Surfscan
- **Modell-Nr. (MDL):** 330345
- **Fabrikations-Nr. (SER):** 1096-228
- **Baujahr:** Oktober 1996
- **Elektrische Daten:** 208V, 17A, 1 Ph, 60 Hz
- **Einsatzmöglichkeit:** Automatische Oberflächeninspektion von Wafern.
-

2. Real-World Particle Generation & Deposition System

- **Hersteller/Typ:** MSP Corporation Model 2300
- **Revision:** Rev. 3
- **Baujahr:** September 1997
- **Funktion:** Präzise Aufbringung von Partikeln auf Oberflächen zu Kalibrierzwecken.
-

3. SMIF Pod Opener / ESC Controller

- **Hersteller:** Brooks / PRI Automation
- **Zustand:** Optisch gepflegt, passend zum System-Setup.

Zustandsbeschreibung & Bemerkungen:

- **Zustand:** Die Geräte weisen altersübliche Gebrauchsspuren auf und stammen aus einem professionellen Laborumfeld.
- **Funktionsprüfung:** Die mechanischen Systeme und Lüfter laufen bei Stromzufuhr an.

Hinweis: Der integrierte Monitor des Tencor 6220 bleibt derzeit schwarz

- **Vollständigkeit:** Die Geräte sind äußerlich vollständig; Typenschilder und CE-Kennzeichnung sind vorhanden.